

裝

置

Faciliti

X射线吸收谱学实验和数据处理讲习班 武汉·2014

硬X射线实验站设备和功能简介、XAS谱实验条件和样品准备优化

郑黎荣 88235980-4 zhenglr@ihep.ac.cn





▶ XAFS实验方法基本要素、注意点、常见问题

▶Hephaestus、SAMPLEM4M 软件功能简介

Beijing Synchrotron Radiation Facility

北

うみ

同

步

辐

射装

置

X射线吸

▶BSRF XAFS实验站介绍(实验技术、性能指标)





步

箱

XAFS实验设计

- □ 从XAFS需要得到什么信息(价态、形态、组分、局 域结构等)
- □样品基本信息的了解(元素构成、比例:相构成等)
- □待测元素吸收边(排除其他元素干扰)
- □ 实验模式选择(待测元素浓度)
- □样品制备(粉末、液体、薄膜等)
- □ 原位实验装置的搭建(空间布局、窗口材料、开口 大小等)
- □线站性能调研(能区、方法、原位设备等)
- □ 提交课题申请(突出XAFS方法所起的作用及其他实 验方法所得到信息的互补与自治)







北

家

同

歩

辐

射装

置

×射线吸收谱学

实

•201*4*

习

Beijing Synchrotron Radiation Facility





用户导航	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
用户须知	▶ XAFS实验、数据处理等相关文件下载
管理条例	▶ XAFS样品制备视频
韦松下带	▶ XAFS开关门、实验模式切换及样品放置视频文件
4218 1 44	▶ X射线荧光微分析实验站数据处理软件下载地址
用户培训	▶ 振动谱分析处理软件(作者:李明)
田业台社	▶ 小角数据预处理软件(作者:李明)
用兀忌结	▶ 光源性能计算程序(作者:李明)
资源下载	▶ A program for SAXS data processing and analysis(Author_Zh

http://www.ihep.cas.cn/dkxzz/bsrf/yonghudaohang/ziyuanxiazai/





和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

·2014



1光源2单色器3探测器4电子学系统





北

寡

同

步

辐

射装





不同波长的光有其不同的用处。同步辐射是一种宽谱、连续的电磁辐射, 尤其在从几 十eV的紫外到数万eV的硬X射线波段都有很高的强度,是实验室光源的十万、 百万倍,为 人类在原子分子水平上认识物质的结构和功能提供了强大的工具和手段。



Beijing Synchrotron Radiation Facility 置 和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验





步

辐射装置



北京同步辐射光束线站示意图

381A 381 4B9B- 光电子能谱的

WIA- 78

1W1B-XAFS &



























今中国科学院高能物理研究所









和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验 -2014





今中国科学院高能物理研究所





Air: 22.7 eV/e⁻ He: 41.5 eV/e

实

•201*4*

X射线激发电离室中的工作气体, 极板收集电离出的电子后形成电

流:

(电流正比于入射光强)









置

LYTLE 探测器的结构原理示意图。

◆大的接收立体角

◆ "Z-1"滤波片,利用吸收边前、后吸收系数的差异

◆sloar狭缝,消除滤波片本身发出的二次辐射





辐

射装

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

2014



◆滤波片的选择是十分关键的。 (使用Hephaestus 查询;其中Ti、Sr对应的滤波片需自备)

滤波片有3、6两种选择,其中3,6指的是吸收长度(X); $\rho^{-\mu X}$











辐

射装

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

·2014









置

数据采集的两个基本问题

测量误差与采样总光子计数:

- XAFS要求测量误差小于10⁻³。不准确的µ(E)可能会对XAFS造成不良影 响,甚至彻底破坏精细结构。由于现代电子技术的发展,放大器的测量精度可达10⁻¹¹ A,而XAFS信号一般在10⁻⁶ A至10⁻⁹ A之间,因而电 子学系统的噪声可以忽略不计。同步辐射XAFS信号噪声重要来源之一 是统计涨落引起的噪声。设某次采样光强为I,采样时间为t,则该次 采样总光子计数为 N=I•t,该次测量相对误差为 $\delta = \sqrt{N}$
- 当确定了测量相对误差要求后,即可得到每次采样总光子计数的值。
 (对XAFS测量,一个数据点的采样总光子计数应高于10⁶)。
- 对相同的采样时间,光强越强相对误差越小;而对相同的光强,采样 时间越长相对误差越小。

信号背底比S/B:

- 透射XAFS谱是由待测元素的XAFS信号及样品中其他元素贡献的吸收背底信号叠加构成。两者的比例构成了信号背底比S/B。
- 样品信号S/B小则使得XAFS信号幅度与吸收背底信号的涨落误差范围接 近,导致XAFS实验数据的信噪比变差。













北

家

同

步

辐

射装

置

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

•201*4*

Beijing Synchrotron Radiation Facility



(1) 高次谐波抑制
 ◆产生原因: *nλ* = 2*d* · Sinθ n=1、2、3
 ◆高次谐波抑制方法: 双晶失谐; 谐波抑制镜



(2) 电离室工作气体配比

◆前电离室吸收为15%-25%,采集的数据具有最佳信噪比;
◆电离室的吸收随X射线能量改变;为保持前后电离室最佳的吸收比例,选用不同长度的电离室或改变其工作气体(使用Hephaestus 查询)





北

寡

同

步

辐

射装

置

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

·2014

Beijing Synchrotron Radiation Facility

XAFS实验注意点

(3) 单色器能量的标定

◆产生原因: 机械误差产生能量漂移;

◆重新标定单色器:在标样金属箔吸收边附近扫描,以吸收边位置定能量。 ◆对于需要进行LCF拟合的样品,建议采用以下同时测量标样的实验模式;



(4) 采谱参数设定

分段	起始能量(eV)	终止能量(eV)	步长(eV)
边前	E0 – 200	E0 – 20	5.0 - 10
XANES	E0 – 20	E0 + 30	0.25 – 1.5
EXAFS1	E0 + 30	E0 + 1000	Δk小于0.05





置

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

·2014









由于公式中Ln函数的存在, 样品的不均匀会导致吸收 谱信号的扭曲;





裝

透射模式注意点

为达到最佳的信噪比,在进行透射法实验时,对样品的要求:

▶ 样品浓度:所含吸收元素百分比 > 5%

▶ 样品厚度:满足吸收边跳高 $\Delta \mu(E)t \approx 1; \mu(E)t \approx 2$ (优先满足跳高)

▶ 样品制备:均质无孔:粉末样品400目(约30um)、涂胶带、压片





和数据 X射线吸 •2M14



寡

同

步

辐

射

裝

置

和数据

2 实





▶ 样品浓度:所含吸收元素百分比含量几十ppm至5%

✓ Lytle模式: 500 ppm至5%

✓ 19元固体探测器 (SDD): 几十ppm至500 ppm

▶ 有利于微量元素的探测,在生命科学、土壤、环境科学和材料科学中具有十 分重要的应用,例如掺杂体系,金属蛋白,催化剂上活性中心的研究。





置

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

·2014



◆前电离室气体配比遵循15-25%吸收原则,调整方法相同; ΠΠ LYTLE 探测器的电离室则充纯氩气。

◆对样品厚度无特定要求,一般可采样压片制样,块材样品可直接 使用。

◆固体探测器的死时间要保持小于25%,数据处理时需要对各道进 行死时间修正; (元素干扰)







置

和数据分析讲习班

2014

些常见问题





和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

2014

一些常见问题









些常见问题



不同吸收厚度滤波片对谱形产生的影响 (红色为滤波片对弹性散射收不够,造成谱线整体上扬的厉害)



和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

·2014

置



北

寡

同

步

辐

射装

置

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

2014

Beijing Synchrotron Radiation Facility

一些常见问题



由于高浓度含Cl离子的液体在X光照射下分解,气泡上浮至光路时,谱线 异常,通过QXAFS的方式,在极短的时间内测量,可以得到较好的谱线







置

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

-2014

些常见问题



当选取计数区域过大时, 样品荧光信号中还包含激发 固探使用时, 峰或干扰元素的荧光信号时;





置

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

-2014

些常见问题







一些常见问题



例:不同型号的3M胶带中的杂质元素对于部分待测元素存在干扰



Beijing Synchrotron Radiation Facility

和数据分析讲习班X射线吸收谱学实验

·2014



▶ XAFS实验方法基本要素、注意点、常见问题

▶Hephaestus、SAMPLEM4M 软件功能简介

Beijing Synchrotron Radiation Facility

北

うみ

同

步

辐

射装

置

X射线吸

▶BSRF XAFS实验站介绍(实验技术、性能指标)





Hephaest

HEPHAESTUS软件简介

Hephaest Hephaestus He	us 1p Absorpt	ion:	рет	riod	dic	tał	ole	of	edg	e a	nd	lin	e e	ner	gie	s		_
Absorption Formulas	L. K.	i Be a Ig K Ca	Sc	Ti	v	Cr	In	Fe	Co	Fi	Cu	Zn	B Al Ga	C Si Ge	J P As	0 S Se	F Cl Br	He Ne Ar Kr
Ion chambers		b Sr s Ba r Ra	T La Ac	Zr Hf Rf	Nb Ta Ha	T Sz	Tc Re Bh	Ru Os Hs	Rh Ir	Pd Pt	Ag Au	Cd Hg	In Tl	Sn Pb	Sb Bi	Te Po	I At	Xe Rn
Data Transitions		Lantha Actii	nides nides	Ce Th	Pr Pa	Hd V	P.	S= Pu	Eu	Gd Cm	Tb Bk	Dy Cf	Ho Es	Er Fo	Tn Nd	Tb No	Lu Lr	
D Edge finder	Element data Property Name	value Promethium		(Absor Edge	ption	edges Ene: 45	rgy 184	¥ (ch) 22.36		V	laores Line Kal	Trai K-L3	lines asitio	n	Energy 38725	r	Strength 0 5196
Line finder	Number 6 Weight 1 Density 6	61 147 amu 6.782 g/cm	^3		L1 L2 L3 M1		7- 7(6- 1)	428 013 459 350	-0.01 4.15 3.57 13.05			Ka2 Ka3 Kb1 Kb2	K-L2 K-L1 K-M3 K-N2	,3		38171 37756 43827 44942	5 7 2	0.2861 0.0001 0.0978 0.0439
Standards					M2 M3 M4 M5		147 1 1 1	1.4 357 052 027	8.25 9.64 1.78 1.02			Kb3 Kb4 Kb5 La1 La2	K-M2 K-N4 K-M4 L3-M	,5 ,5 5		43712.6 45064 44132 5432 5407		0.0506 0.0004 0.0015 0.7482
F' and F"					N1 N2 N3 N4 N5			242 242 120 120	-1.52 -1.52 1.29 1.29			Laz Lb1 Lb2 Lb3 Lb4	L3-M L2-M L3-N L1-M L1-M	4 4,5 3 2		5961 6339 6071 5956, 6)	0.0833 0.8433 0.1588 0.4899 0.2919
Configure	Filt	ter Cr ot filter			N6 N7 01 02			4 4 38 22	-0.17 -0.17 0.10 0.10			Lb5 Lb6 Lg1 Lg2	L3-0 L3-N L2-N L1-N	4,5 1 4 2		6128 6893 7186	}	0.0066 0.1361 0.0919
					03			22	0.10		J	Lg3 Lg6 11	L1-N L2-0	3 4 1		7186	5	0.1264

Demeter软件包中与XAFS相关可能用到的各种数据库的一个软件;



和数据分析讲习班 2014